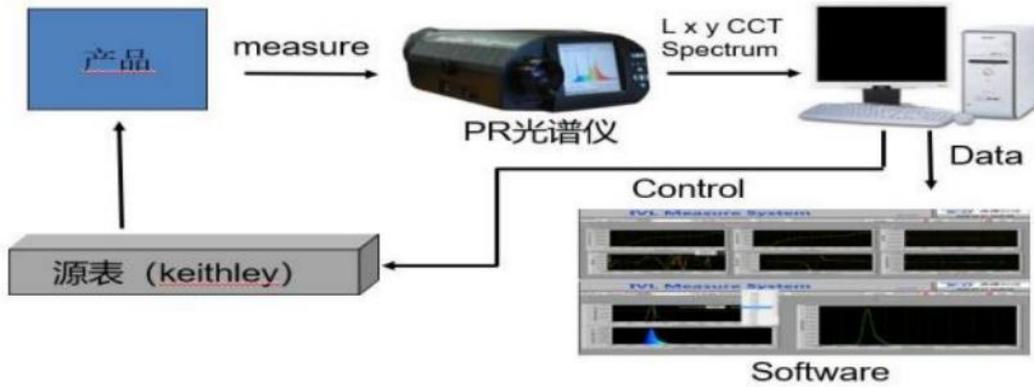


多片式 OLED-IVL 测量系统

系统说明: 多片式 IVL 测试系统应用于大批量测试 IVL 性能曲线以及在视角变化过程中亮度的变化。主要面向 OLED 材料制作和 OLED 屏体的生产厂商。

一、系统原理



二、系统特点

- 灵活多片式
- 大视角测量
- CCD 自动对位系统
- 系统高度集成
- 温度控制单元 (选配)
-

三、设备系统实物展示



四、测试项目

细项	仕様	备注
量测项目-全自动定点量测	Luminance	
	Color	
	OCT (Color Temperature)	
	Volt	
	Current	
	Joule (mA/cm ²)	
	Lm/W	
	Cd/A	
	Uniformity	
	Spectrum	